



Bildverarbeitungsunterstützte Mikro-Kontaktiereinheit

Der Trend in der Elektronikindustrie geht zu ständig kompakteren elektronischen Baugruppen mit einer immer höheren Packungsdichte. Das führt zu immer kleineren Testpunkten. Durchmesser mit einer Größe von 0,2 mm werden in der Elektronik Einzug halten und müssen kontaktiert werden. Gleichzeitig werden vermehrt flexible Leiterplatten, Keramik-Substrate und Glasplatten eingesetzt.

Mit herkömmlichen Kontaktierstationen sind diese Prüflinge nicht mehr testbar. Die Firma ENGMATEC GmbH aus Radolfzell hat diese Anforderungen des Marktes aufgegriffen und ein entsprechendes Testsystem auf den Markt gebracht. Die neu entwickelte Kontaktiereinheit „MTH“ (Micro Test Handler) ist mit Hilfe eines integrierten Bildverarbeitungssystems in der Lage, kleinste Kontaktflächen präzise zu kontaktieren.



Kleine Testpunkte mit einer Größe von 0,2 mm können mit dem „Micro Testhandler“ zuverlässig geprüft werden. Die Prüflinge benötigen bei dieser Lösung keine Zentrierbohrungen, was auch die Kontaktierung von Keramiksubstraten, Glasplatten und Flexiblen Leiterplatten ermöglicht. Mit Hilfe eines Kamerasystems werden die Kontaktstifte entsprechend der Lage der Testpunkte auf den Prüfling ausgerichtet. Es ist eine Lagekorrektur von ± 2 mm und 3 Grad möglich.

Auf der SMT vom 8.-10. Juni in Nürnberg wird ENGMATEC den Mikro - Kontaktierhandler „MTH“ dem Fachpublikum vorstellen.

